

# RTTLIT P10 实时瞬态锁相热分析系统

## RTTLIT Thermal Emission Microscopy System

RTTLIT P10 实时瞬态锁相热分析系统，采用非制冷型热红外成像系统，通过锁相热成像（Lock-in Thermography）技术，通过调制电信号提升特征分辨率与灵敏度，结合软件算法优化信噪比，以实现显微成像下的高灵敏度热信号测量。



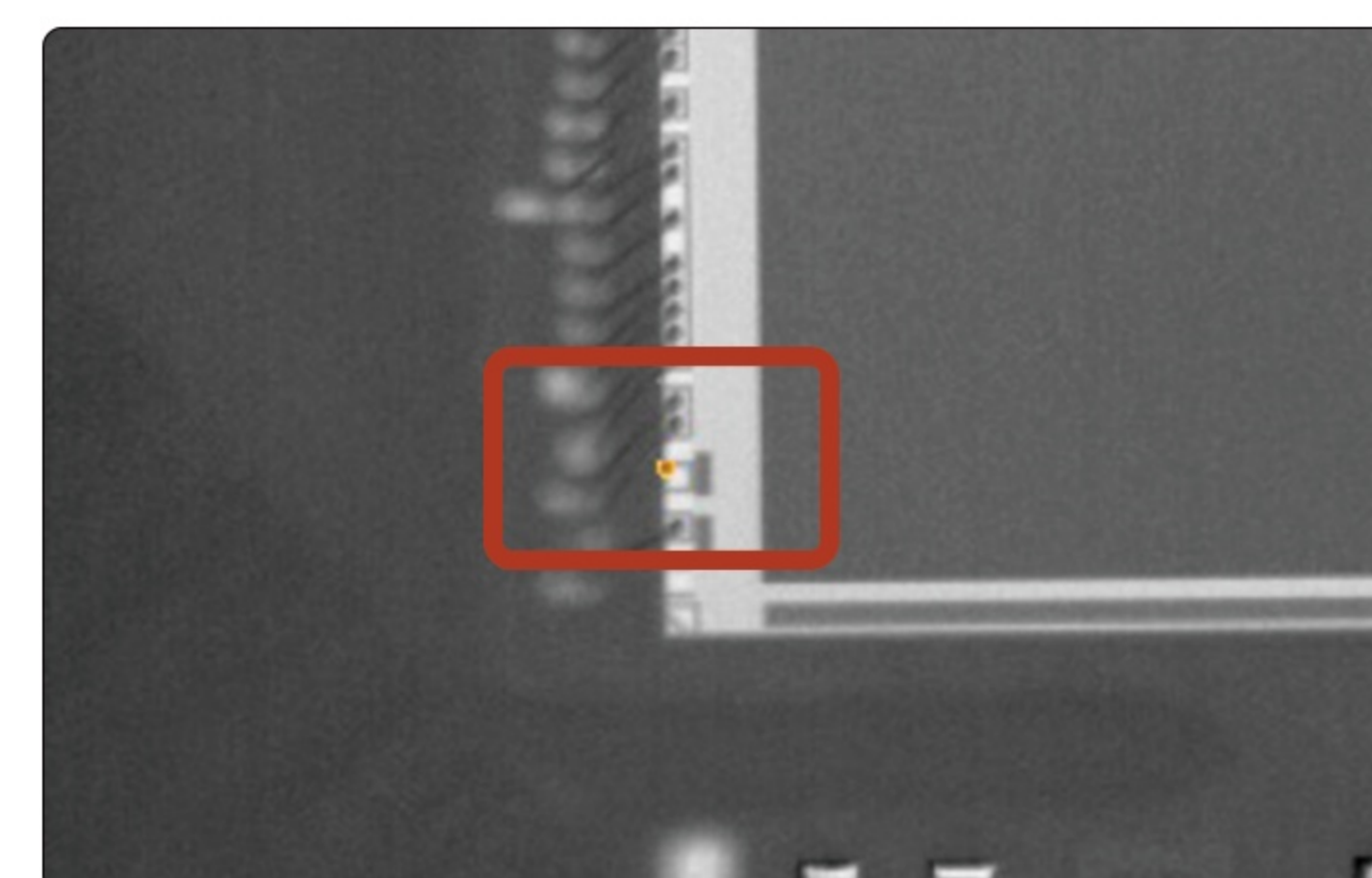
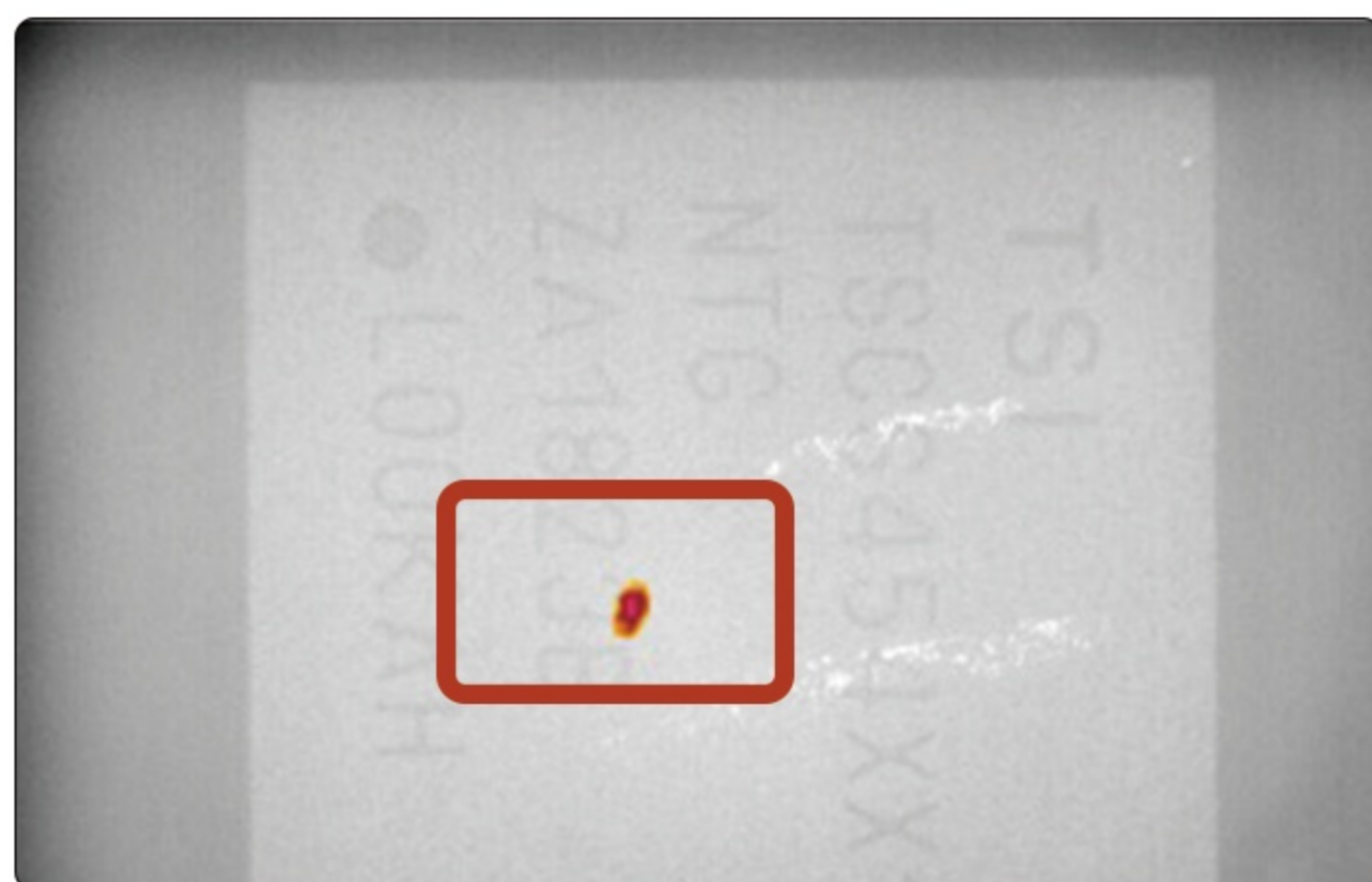
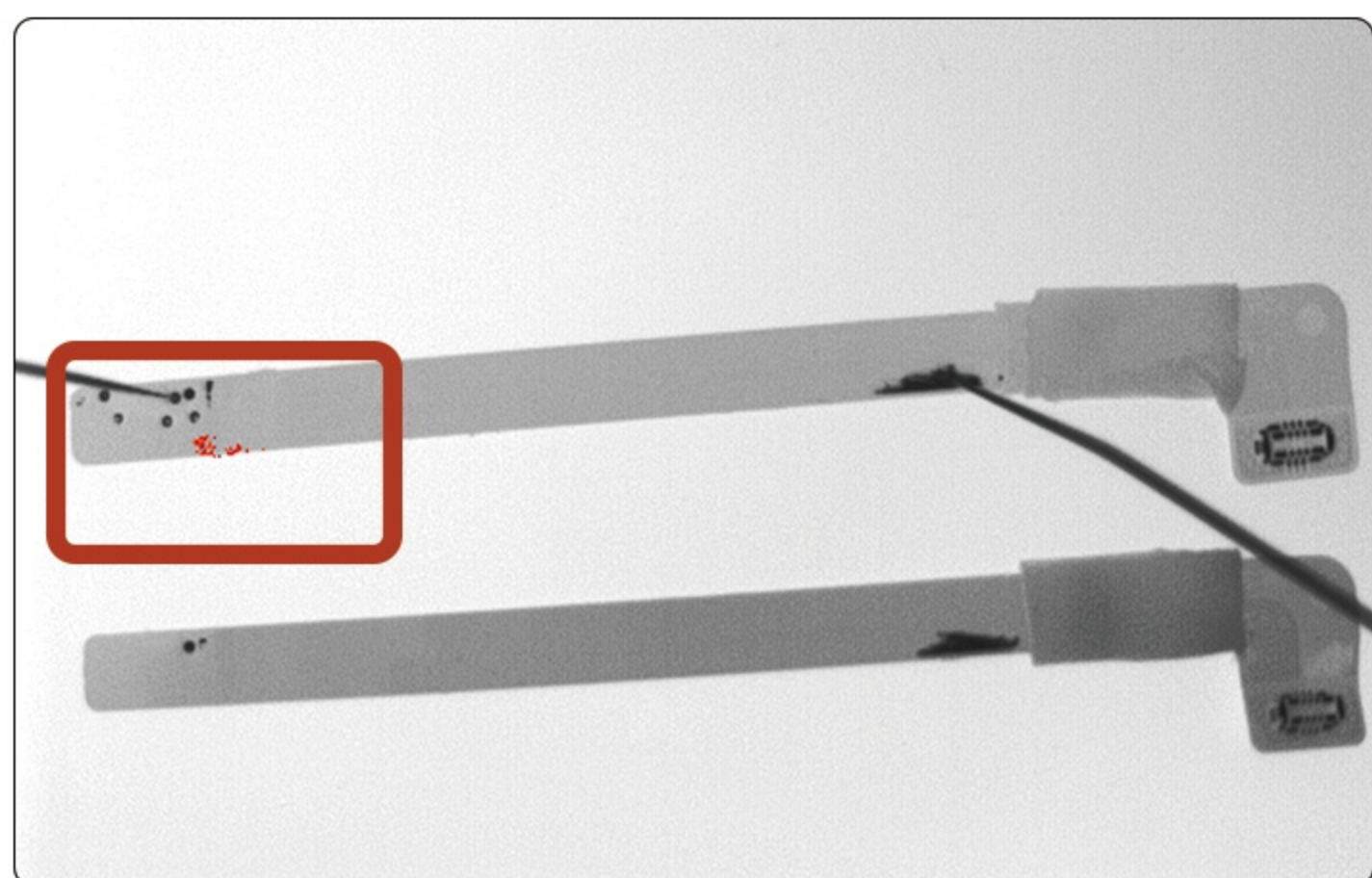
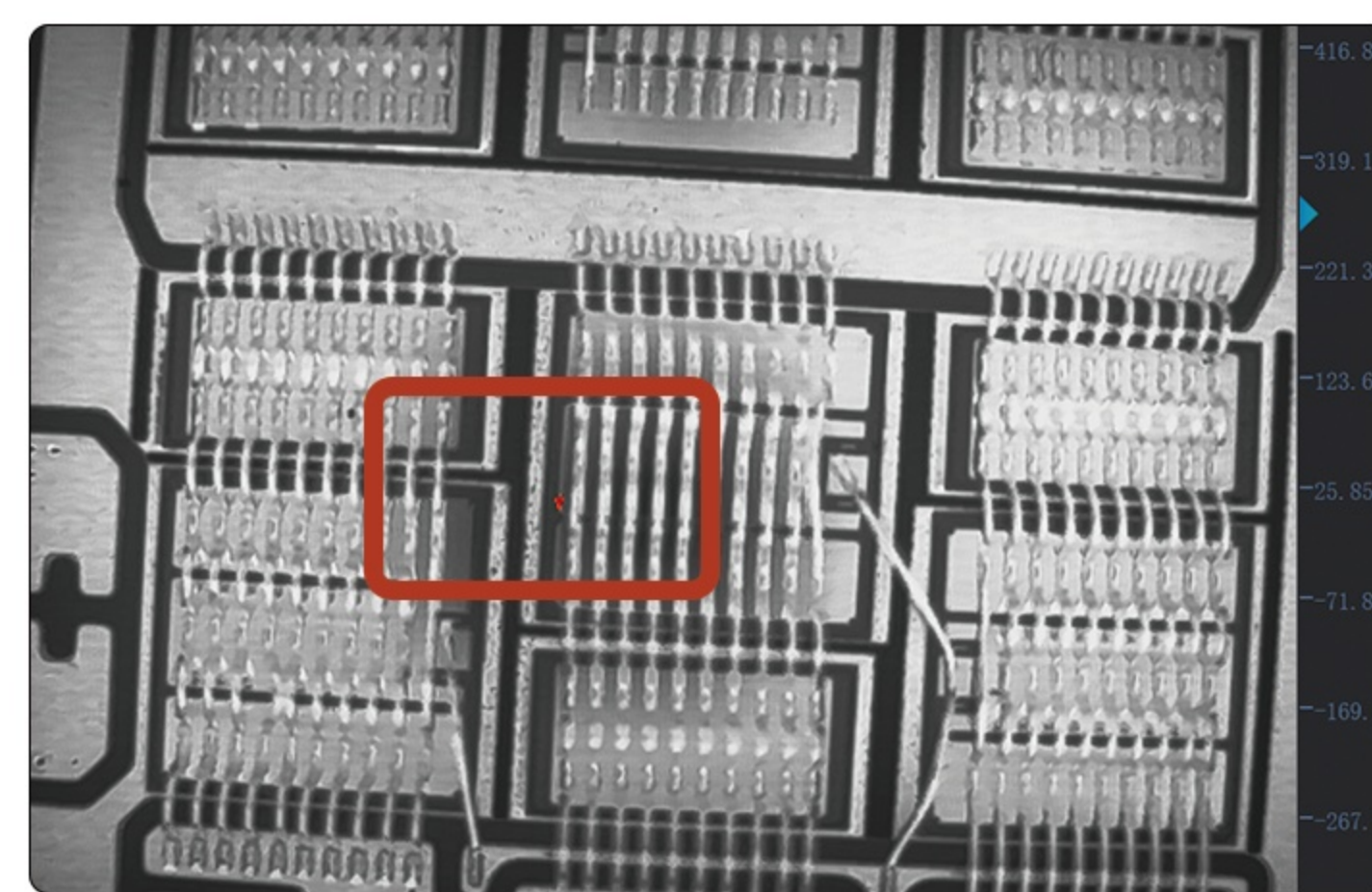
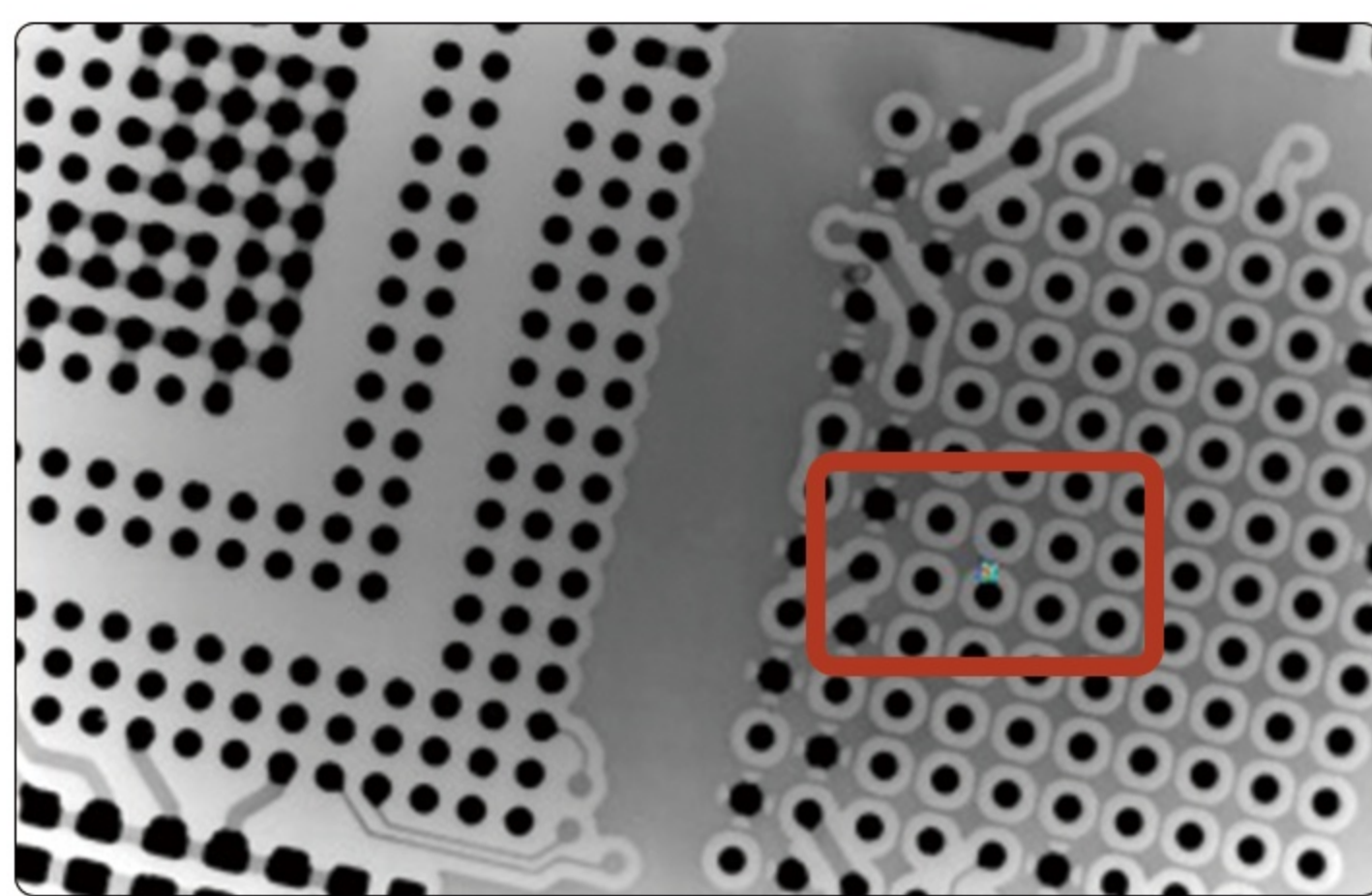
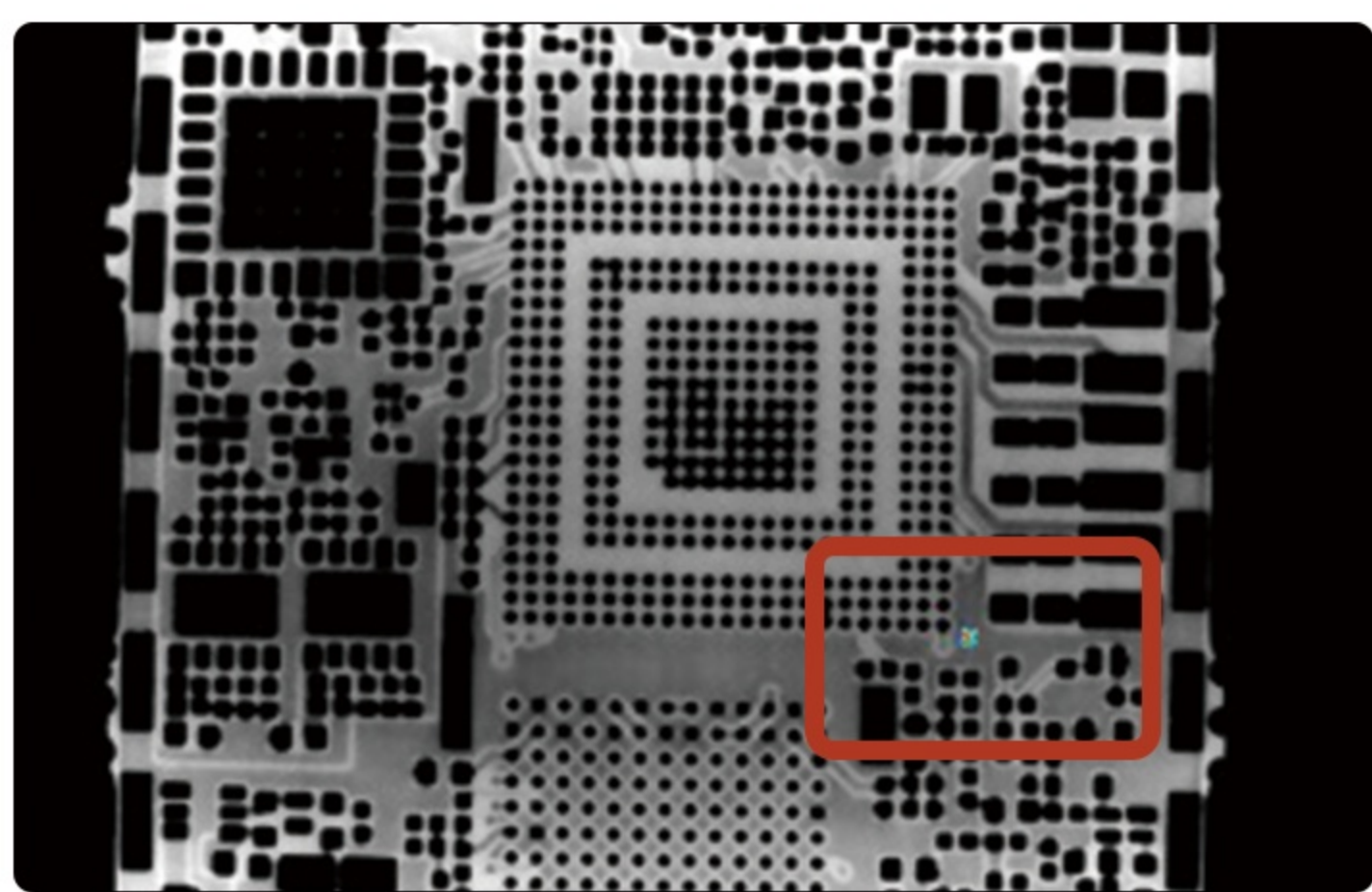
### 产品介绍

### Product Introduction

RTTLIT P10 具有高灵敏度高性价比等优点，锁相灵敏度可达灵敏度 $0.001^{\circ}\text{C}$ ，最高显微分辨率 $5\mu\text{m}$ 。其重点是应用于电路板失效分析、PCB、PCBA、大尺寸主板、分立元器件、MLCC电容、功率模块维修检测等领域，分析速度快，检测精度更高。

### 案例展示

### Case Presentation



| 设备参数  | RTTLIT实时瞬态锁相热分析系统   |
|-------|---------------------|
| 品牌    | Zansun（致晟光电）        |
| 型号    | RTTLIT P10          |
| 探测器   | 探测器类型：氧化钒           |
|       | 探测波长：7~14 μm        |
|       | 帧频(可选): 50 Hz       |
|       | 制冷方式：非制冷            |
|       | 分辨率：640 * 512       |
|       | NETD：40 mK          |
| 锁相测试  | 锁相灵敏度：0.001℃        |
|       | 锁相频率：0.001 Hz~12 Hz |
| 光学物镜  | 可选倍率：               |
|       | Micro 广角镜头          |
|       | 0.2X 镜头             |
|       | 0.4X 镜头             |
|       | 1X 镜头               |
|       | 3X 镜头               |
| 最小分辨率 | 5 μm                |



公众号

网 址：[www.zansun.com](http://www.zansun.com)

邮 箱：[info@zansun.com](mailto:info@zansun.com)

电 话：400-666-8879

地 址：苏州虎丘区湘江路创业街60号创捷科技园E幢1001-1004